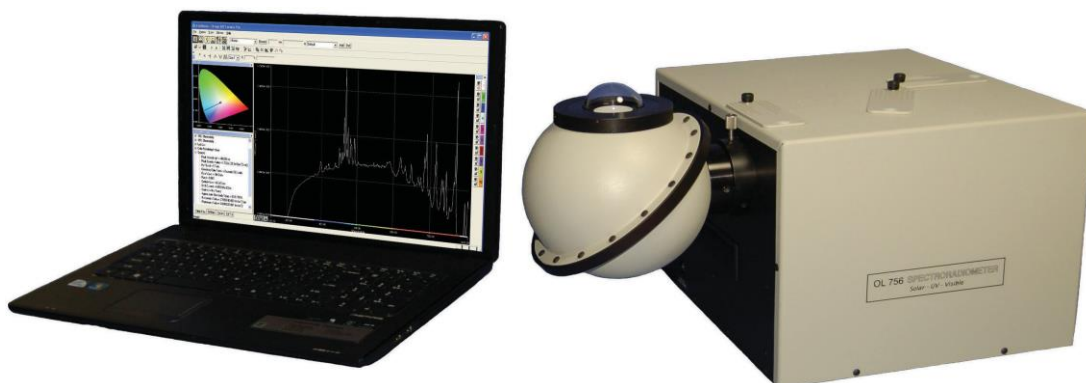


UV-VIS 分光放射計 OL756



分光放射計 OL756 は紫外域～可視域（200～800nm）を測定可能な分光放射計です。ダブルモノクロメーターを採用しており、迷光除去性能に優れています。迷光の除去は、広帯域の可視光が存在する中で紫外域（UV）が安全なレベルに抑制されているかどうかを測定する場合に必要な不可欠です。

交換可能なスリットによりユーザーは波長幅（半値幅）を 0.4～10nm の範囲で任意の値に設定できます。スリットサイズを小さくすることで高分解能の測定、大きくすることで光出力の低い対象の測定が可能になります。

高効率なホログラフィックグレーティング（回折格子）は、UV における測定性能を向上させます。また、入射スリット後に配置された自動フィルターは、フィルターホイールを急に停止させたり動かせたりすることなく二次回折光を除去します。

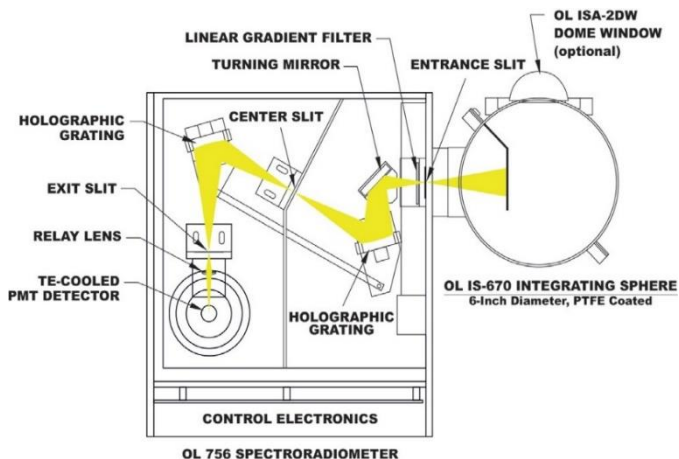
OL756 には単一ポイントのモニタリングや経時変化をロギングする為の手动設定があります。

デジタル信号処理についても、高速スキャン・低ノイズ・6桁のゲインオートレンジ機能による分光測定を実現しています。内蔵フラッシュメモリにより、システムパラメーターを保存できます。

お客様の要望に合わせて幅広い測定アクセサリ・補正光学系のラインアップから適切なシステムを提案することが可能です。

主な測定アプリケーション

- ・ 生物学的研究
- ・ 地表および水中での太陽放射
- ・ ソーラーシミュレーター特性評価
- ・ UV 硬化ランプシステムの検証
- ・ UV 殺菌ランプシステムの検証
- ・ 目へのリスク評価
 - 照明器具、眼科処置および製品の安全性
- ・ 内視鏡および手術用照明器具の開発と校正
- ・ 紫外線療法および製品の用量決定と安全性評価
- ・ 日焼け止めクリーム、レンズ、シェード生地等、紫外線保護の検証
- ・ 製品の透過率測定
- ・ 日焼けマシンの放射照度測定



OL 756 SPECTRORADIOMETER

UV-VIS分光放射計 OL756 仕様

測定波長範囲	200 – 800 nm
ダイナミックレンジ	10 ⁷
波長幅 (半値幅)	0.4–10 nm (交換可能)
測定スピード	200 nm/sec ※クイックスキャンモード-全波長測定 3s
受光部	熱電冷却式S-20 光電子増倍管 (PMT) デテクター
インターフェース	USB
電源	12VDC

ソフトウェアの特長



OL756 アプリケーションソフトウェアは非常に柔軟なプロット操作を特徴としており、1つのグラフに最大10個の測定データを表示します。

「スキャン非表示」および「スキャンロック」機能で1つまたは複数のデータを選択・保護

ユーザー定義の測定設定を保存およびロードする機能、「ワンクリック」測定、自動保存機能

スペクトルプロットズームやドラッグによるスペクトルデータの高精度表示

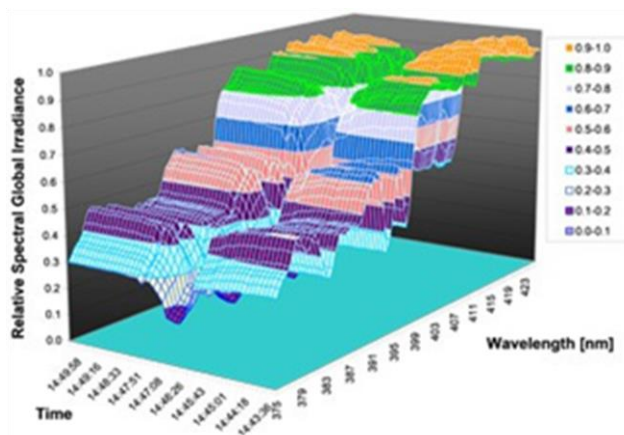
キャリブレーションファイルリストは最近使用したファイルを表示することにより検索や選択にかかる時間を節約できます。

正確な色研究のためズーム機能を備えたCIE色度図、色度上には連続的な測定結果を蓄積できます。

ソフトウェア仕様

プロットツール/カーソル	高精度分光分析が可能
データ管理	データ保護、測定設定の保存
Microsoft Officeへのデータ・レポート出力	ExcelやWord上でデータ操作や分析レポートを編集可能
測定結果	色度、Lab Luv、演色性CRI、分光測定値、太陽灯の露光量比率、PAR Irradiance…etc
プロットの補正	Savitzky-Golay FIR平滑化フィルター機能を維持しながらノイズを低減
SDK	カスタムプログラミング
対応OS	Windows 10 (32 and 64 bit)

曇りの日の太陽光測定



0.25秒ごとに分光測定され、リアルタイムでExcelファイルにデータが出力されます。

OL756シリーズ

756	分光放射計本体、ソフトウェア
756-1	分光放射計本体、ソフトウェア IS-670 φ15cm積分球
756-2	分光放射計本体、ソフトウェア、 IS-670 φ15cm積分球、 標準アダプタ、756-150校正光源
756-150	校正用光源 波長域 250~800nm 5W ハロゲンタンクステン
756-420	ソフトウェア開発キット
756-BAT	バッテリーパック
756-CC	キャリングケース